

Tisch-Rasterelektronenmikroskop Phenom

Deutschland GmbH)

(Fei

Anwendung: Wiedergabe von Probenoberflächen mit hoher Auflösung und guter Tiefenschärfe



- Low- und Highvakuummodus
- Vergrößerung: 20x – 24000x
- Probenwechsel in weniger als 30 sec
- Abbildung im Millimeter- bis hin zum Nanometerbereich
- Bildformate in JPEG oder TIFF
- Mit 3D-Roughness Reconstruction